README.md 2025-07-01

STDF Wafer Map Generator (Java)

本專案可將 .out 格式的 STDF 測試結果轉為 .csv · 並根據 X/Y 座標繪製晶圓圖、統計良率 · 並輸出結果 (文字報告與彩圖)。

專案結構

使用步驟

step1 將 .stdf 檔轉為 .out

請先使用 STDF 工具列印 STDF 結構至純文字格式:

```
java -cp lib/StdfDump.jar ri.core.stdf.StdfDump
unpacked/main_Lot_1_Wafer_1_Oct_13_09h33m41s_STDF
```

執行後會產出 .out 檔案,例如:

```
Output saved to: unpacked/main_Lot_1_Wafer_1_Oct_13_09h33m41s_STDF.out
```

step2 編譯並執行 Java 轉檔

```
javac -d . src/StdfOutToCsv.java
java StdfOutToCsv
```

輸出為 converted.csv,內容範例如下:

README.md 2025-07-01

```
X,Y,PART_ID,BIN
-5,-4,1,1
-1,-4,2,1
4,-4,3,2
6,-4,4,1
7,-4,5,1
...
```

step3 產生晶圓圖與良率報告

```
javac -d . src/WaferMapGenerator.java
java WaferMapGenerator
```

執行結果會輸出:

功能說明

- 自動解析 X, Y, PART_ID, BIN
- 依據座標重建晶圓格狀結構
- 以終端機顯示文字晶圓圖 (P為 Pass、F為 Fail)
- 匯出良率報告.txt
- 匯出兩張彩圖: PART_ID 以及 BIN 為基礎的晶圓圖

聯絡與貢獻

作者 / Author: 張婷佳 (Jessie Chang)

Email: tingchaaa@gmail.com